

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung



Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Kalibrierlaboratorium

GIGAHERTZ Optik Vertriebsgesellschaft für technische Optik mbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Kalibrierungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

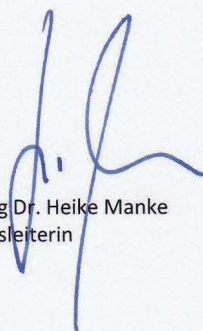
Hochfrequenz- & Strahlungsmessgrößen
Optische Messgrößen
– Radiometrie

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 16.02.2018 mit der Akkreditierungsnummer D-K-15047-01 und ist gültig bis 15.02.2023. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 2 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-K-15047-01-00**

Braunschweig,
16.02.2018

Im Auftrag Dr. Heike Manke
Abteilungsleiterin



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die auszugsweise Veröffentlichung der Akkreditierungsurkunde bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS). Ausgenommen davon ist die separate Weiterverbreitung des Deckblattes durch die umseitig genannte Konformitätsbewertungsstelle in unveränderter Form.

Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass sich die Akkreditierung auch auf Bereiche erstreckt, die über den durch die DAkKS bestätigten Akkreditierungsbereich hinausgehen.

Die Akkreditierung erfolgte gemäß des Gesetzes über die Akkreditierungsstelle (AkkStelleG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2625) sowie der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten (Abl. L 218 vom 9. Juli 2008, S. 30). Die DAkKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Die Unterzeichner dieser Abkommen erkennen ihre Akkreditierungen gegenseitig an.

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org

ILAC: www.ilac.org

IAF: www.iaf.nu

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15047-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Gültigkeitsdauer: 16.02.2018 bis 15.02.2023 Ausstellungsdatum: 16.02.2018

Urkundeninhaber:

GIGAHERTZ Optik Vertriebsgesellschaft für technische Optik mbH
An der Kälberweide 12, 82299 Türkenfeld

Leiter:	Dipl.-Ing. (FH) Anton Gugg-Helminger
Stellvertreter:	Dipl.-Ing. (FH) Stephan Fenk

Akkreditiert als Kalibrierlaboratorium seit: 22.06.1993

Kalibrierungen in den Bereichen:

Hochfrequenz- & Strahlungsmessgrößen
Optische Messgrößen
– Radiometrie

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Permanentes Laboratorium

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	kleinste angebbare Messunsicherheit ¹⁾	Bemerkungen
Spektrale Empfindlichkeit Photodioden	1 $\mu\text{A/W}$ bis 1 A/W	250 nm bis 300 nm	3,0 %	Klemmenspannung an Photodiode $\leq 50 \mu\text{V}$ $1 \text{ nW} \leq \Phi \leq 10 \mu\text{W}$ $18^\circ\text{C} \leq t \leq 28^\circ\text{C}$ $1 \text{ nm} \leq \Delta\lambda \leq 11 \text{ nm}$
		> 300 nm bis 320 nm	2,9 %	$100 \text{ nW} \leq \Phi \leq 100 \mu\text{W}$ $18^\circ\text{C} \leq t \leq 28^\circ\text{C}$ $1 \text{ nm} \leq \Delta\lambda \leq 11 \text{ nm}$ Φ = Strahlungsleistung auf der Empfänger- fläche t = Temperatur des Kalibriergegenstandes $\Delta\lambda$ = spektrale Halb- wertsbreite
		> 320 nm bis 340 nm	2,6 %	
		> 340 nm bis 360 nm	2,3 %	
		> 360 nm bis 400 nm	2,0 %	
		> 400 nm bis 880 nm	1,7 %	
		> 880 nm bis 920 nm	2,0 %	
		> 920 nm bis 960 nm	2,4 %	
		> 960 nm bis 1040 nm	3,0 %	
		> 1040 nm bis 1160 nm	4,0 %	
Spektrale Bestrahlungsstärke Glühlampen	10 $\mu\text{W}/(\text{m}^2\text{nm})$ bis 0,30 $\text{W}/(\text{m}^2\text{nm})$	250 nm bis 260 nm	6,3 %	$200 \text{ W} \leq P \leq 2000 \text{ W}$ P = elektrische Leistung Lampe
		> 260 nm bis 270 nm	5,2 %	
		> 270 nm bis 280 nm	4,1 %	
		> 280 nm bis 300 nm	3,7 %	
		> 300 nm bis 390 nm	3,1 %	
		> 390 nm bis 780 nm	2,8 %	
		> 780 nm bis 1040 nm	3,3 %	
		> 1040 nm bis 1550 nm	3,8 %	
		> 1550 nm bis 1950 nm	4,3 %	
		> 1950 nm bis 2000 nm	4,7 %	
		> 2000 nm bis 2050 nm	5,1 %	
		> 2050 nm bis 2100 nm	5,5 %	
		> 2100 nm bis 2150 nm	5,9 %	
		> 2150 nm bis 2200 nm	6,3 %	
		> 2200 nm bis 2250 nm	6,7 %	
		> 2250 nm bis 2300 nm	7,1 %	
		> 2300 nm bis 2350 nm	7,5 %	
		> 2350 nm bis 2400 nm	7,9 %	
		> 2400 nm bis 2450 nm	8,5 %	
		> 2450 nm bis 2500 nm	10 %	

¹⁾ Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor $k = 2$. Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.